

2016 年度「ぶんせき講習会」(実践編)

第 63 回機器による分析化学講習会 ～ X 線分析法による薄膜分析～

主催 (公社) 日本分析化学会近畿支部, 近畿分析技術研究懇話会
協賛 (公社) 化学工学会関西支部, (一社) 近畿化学協会, (公社) 日本化学会近畿支部,
(公社) 有機合成化学協会関西支部, 関西分析研究会

X線分析はエレクトロニクス, 環境, エネルギーなどさまざまな産業分野における材料分析に広く利用されています。近年では半導体や電子製品の小型化や高機能化に伴い, 薄膜デバイスの特性評価や製品管理にも X 線分析が不可欠となっています。本講習では X 線分析の基礎と薄膜分析について, 講義と実習を通して学んでいただきます。X 線回折法(XRD), X 線反射率法(XRR), 蛍光 X 線分析法(XRF)を用いて, 膜厚, 密度, 組成, ラフネス, 結晶, 配向など薄膜物性の相補的な分析を行います。X 線分析の例として, 薄膜分析を行う際の測定条件設定のポイントや解析方法を学んでいただきます。

日時 平成 28 年 7 月 22 日 (金) 10:00~17:00 (受付 9:30~)

場所 (株)リガク 大阪支社・大阪工場

(〒569-1146 大阪府高槻市赤大路町 14-8, TEL: 072-693-3800)

<交通> JR 摂津富田駅下車徒歩 20 分 / タクシー 2km 以内, 阪急総持寺駅下車徒歩 8 分

【講習内容】

1. 講義「X 線分析法概論」 (10:10~11:00)
京都大学大学院工学研究科 河合 潤 氏
2. 講義「めっき・表面処理分野における表面・界面分析
～防食技術からエレクトロニクス実装まで～」 (11:10~12:00)
(地独) 大阪市工業研究所電子材料研究部 小林 靖之 氏
3. 実習 (13:00~16:30)
(株)リガク 大淵 敦司 氏, 森川 千晶 氏, 高原 晃里 氏, 日下部 寧 氏
実習項目 (予定)
・ X 線回折法 (XRD) および X 線反射率法 (XRR) による薄膜分析法
・ 波長分散型蛍光 X 線分析法 (WDXRF) による薄膜分析法
4. 質疑応答 (16:30~17:00)

*参加者には事前に電子メールにて PDF 資料を送付, 必要に応じて当日に簡易コピーを配布します。

*当日はテキストの配布は行いませんので, 各自で PDF を印刷して持参して下さい。

*講習会を受講し, 所定の認定条件を満たした者には, 日本分析化学会近畿支部「ぶんせき講習会受講認定証」を付与します。

*事務局で昼食を用意します。

参加費 主催・協賛団体所属会員 10,000 円, 学生 5,000 円, 会員外 20,000 円 (昼食代を含む)
定員 32 名 (定員になり次第締切)

申込方法 参加ご希望の方は, 下記に必要事項を明記のうえ, お申し込み下さい。なお, 参加費は銀行振込 (「りそな銀行御堂筋支店普通預金 No. 2340726 公益社団法人日本分析化学会近畿支部 名義」) をご利用下さい。

*参加決定者には参加費の振り込みを確認後, 参加証をメールにて送付いたします。当日, この参加証を持参して下さい。

*参加決定者には団体傷害保険に加入していただきます。保険料は参加費に含まれます。

*同業者のお申込みの場合には, 午後の実習を遠慮していただく場合がありますことをご了解ください。

申込期限 2016 年 7 月 15 日 (金) (7 月 16 日以降のキャンセルは不可)

申込先 公益社団法人 日本分析化学会近畿支部
〒550-0004 大阪市西区靱本町 1-8-4 大阪科学技術センター 6 階
TEL: 06-6441-5531 / FAX: 06-6443-6685 / E-mail: mail@bunkin.org

問い合わせ先 長谷川 健 (京都大学化学研究所) htakeshi@sci.kyoto-u.ac.jp

※「基礎編その 2」は 6/24(金), 於: 島津製作所・関西支社(梅田), 「電子天秤・pH メータの原理と使い方」, 「発展編」は 11 月頃, 於: 大阪市立大学, 「光ピンセットの基礎と分析化学への実践的応用」をそれぞれ予定しています。

2016 年度「ぶんせき講習会」実践編 参加申込書

(H28)

氏名			所属団体	
勤務先				
所属				
所在地	〒			
	TEL	FAX		
	E-mail			
送金内容	参加費	円	銀行振込	月 日送金 (予定) <input type="checkbox"/> 請求書 要